**XRI-100 X射线检测仪**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仪器型号** | XRI-100 |  |
| **仪器状态** | 完好 |
| **存放地点** | 崇义楼A115 |
| **主要用途** | 用于电子工业生产装配中出现的短路、开路、冷焊和焊点空洞等质量问题。 |
| **负责人** | 郑钢丰 |
| **仪器简介** | XRI-100采用密封型微焦斑X光管及高分辨率X射线增强屏，无需抽真空，可以轻易穿透带散热片的芯片，图像更加清晰。所有操作可通过计算机独立完成，高稳定性的运动平台可在X、Y、Z方向大行程运动，倾斜检测模式可使用户更为准确的判断焊接质量。 |
| 主要用途 | 在质量检测中的应用： 1．适用于BGA、CSP、Flip Chip 集成电路内部的质量检测； 2．多层电路板的质量检测； 3. 可用于其他领域的X射线检测。  |
| 技术参数： | 1. X光管

光管电压：30-80Kv可调；光管电流：0-0.25mA可调；1. 增强屏

分辨率（lp/cm）：120;视野（Inch）:31. 载物台

尺寸（mm\*mm）：400\*400;X轴运动距离：±200； Y轴运动距离：±200；Z轴运动距离：170；4.电源功：AC 220V 50Hz 0.5Kw。 |